

# ユーザーズセミナー

## SEM/TEM/XAFS

ものづくりにおいて、材料の組織、構造、局所構造は、その材料の物性と密接に関連するため、より正確な材料の評価・解析が求められます。そのため、得られた知見は、新しい材料設計をするための重要な指針となります。

今回、マクロ～ミクロまでの組織、構造、局所構造解析の手段として、電子顕微鏡(SEM/TEM)、放射光を用いた分析方法(XAFS法など)について、わかりやすく解析事例をご紹介します。

【日時】平成30年8月8日(水) 13:00～15:30

【会場】豊橋技術科学大学 教育研究基盤センター3階セミナー室(305室)

【対象】学内の教職員・学生及び企業等の技術者・研究者等

【参加費】無料：学生、教職員(本学含む大学、工業高校、高専)  
有料：一般(3,000円)

【定員】70名

【日程】下記のとおり

時間	内容	講師
13:00～13:05	あいさつ	教育研究基盤センター長 教授 滝川 浩史
13:05～14:00	TEM/SEMによる組織・構造解析の基礎と応用	教育研究基盤センター 教授 中野 裕美
14:00～14:05	休憩	
14:05～15:30	放射光を用いた分析方法 -XAFS法の紹介、原理解説、事例等の紹介-	名古屋大学シンクロトロン光研究センター 教授 田淵 雅夫

★資料準備のため、参加を希望される場合は下記まで事前にお申し込みください。  
(お名前、ご所属、連絡先(TEL、E-mail)をメールでお知らせください。)

<申込期限>平成30年8月3日(金)

【申込窓口】豊橋技術科学大学  
研究支援課センター支援係 萩原・白井  
E-mail : kencen@office.tut.ac.jp  
TEL : 0532-44-6574